基于 Add-drop 型微环谐振腔的硅基高速 电光调制器设计^{*}

曹彤彤 张利斌 费永浩 曹严梅 雷勋 陈少武*

(中国科学院半导体研究所,集成光电子学国家重点实验室,北京 100083) (2013年4月27日收到;2013年6月19日收到修改稿)

相比于传统的 All-pass 型微环谐振腔硅基电光调制器, Add-drop 型微环谐振腔可提供更多的设计自由度, 使调制器在不改变杂质掺杂浓度的情况下就能在调制带宽和消光比性能上获得均衡考虑. 本文设计了基于 Add-drop 型微环谐振腔的高速、且在低调制电压下实现大消光比的硅基电光调制器, 所用微环谐振腔的半径仅仅为 20 µm. 重点分析了直波导与微环谐振腔的耦合对调制器性能的影响, 发现较小的 Drop 端耦合系数有利于消光比的提高, 但是不能同时达到最佳的调制带宽, 因此设计上存在一个带宽和消光比性能上的折中考虑. 根据优化设计的结果进行了实际器件的制作和测试. 静态光谱测试表明, 在 3 V 反向偏置电压的作用下, 调制器的消光比最大可达 12 dB. 动态电光响应测试中, 在仅仅 1.2 V 的信号幅值电压下测得了 8 Gbps 数据传输速率的清晰眼图.

关键词:电光调制器,绝缘体上的硅,微环谐振腔,载流子色散效应 PACS: 42.82.-m, 42.79.Hp DOI: 10.7498/aps.62.194210

1引言

作为电互连传输瓶颈 [1] 的一种解决方案, 光 互连^[2]具有低损耗、低延迟、宽频带、低电磁干 扰等特点,以光互连代替电互连将是未来的一大 发展趋势. 硅基光互连 [3] 是指利用硅基光子器件 进行光互连,其制作工艺与传统的 CMOS 工艺兼 容,在制作成本上拥有巨大的潜在优势. 硅基电光 调制器是硅基光互连的重要组成部分^[4],因此,对 其性能的研究具有十分重要的意义.由于硅是中 心反演对称晶体,没有线性电光效应,因此硅基波 导中的电光调制往往利用硅材料的载流子色散效 应^[5]. 通过改变硅基波导中的载流子(电子和空 穴)浓度,就可以改变波导的有效折射率和光波的 相位,从而实现电光调制.通常有两种调制方式: 一种是基于正向偏置电压的调制 [6,7], 在波导中做 pin 结掺杂, 其特点是调制效率高, 但是由于受限 于较缓慢的载流子输运过程,其带宽往往较低;另

一种是基于反向偏置电压的调制 [8-11], 在波导中 做 pn 结掺杂, 在反向偏置电压下由于 pn 结未处 于导通状态,所以其载流子输运非常快,带宽也通 常较高.在光学结构上,基于微环谐振腔的反偏 pn 结型电光调制器具有结构紧凑,调制电压低的特 点,近年来成为国内外研究的热点^[9-11],然而,目 前微环型调制器大部分都是基于 All-pass 型微环, 基于 Add-drop 型微环的调制器相关的分析和器件 制作则较少报道. 由于存在 Drop 端光输出, 基于 Add-drop 型微环的调制器能够通过调整 Drop 端的 Gap 值来改善消光比与带宽, 而不必改变 pn 结的掺 杂工艺.因此,我们对基于 Add-drop 型微环的反偏 pn 结调制器做了分析和设计. 重点讨论了直波导 与微环谐振腔的耦合对调制器性能的影响,并进行 了实际器件的制作和测试.测试结果表明,所制作 的器件具有较大的静态消光比 (3 V 反偏电压时约 12 dB) 和较高速的数据传输性能 (8 Gbps 数据传输 速率).

^{*}国家自然科学基金(批准号: 60837001, 61021003)资助的课题.

[†] 通讯作者. E-mail: swchen@semi.ac.cn

^{© 2013} 中国物理学会 Chinese Physical Society

2 设计和仿真

2.1 器件结构和工作原理

器件的整体结构俯视图如图 1(a) 所示, 光学结构为 Add-drop 型微环, 由两条直波导和一个微环 谐振腔波导构成, 微环谐振腔的半径为 *R* = 20 µm, 波导采用基于 SOI 的脊型光波导. 在谐振腔微环波 导内外侧分别做 p 型和 n 型杂质掺杂, 在波导脊形 区就会形成 pn 结, 如图 1(b) 所示. 当 pn 结外加反 偏电压发生变化时, pn 结的宽度也会发生变化. 根 据硅波导中的载流子色散效应, 波导内硅材料的折 射率与载流子浓度有关. 这样, 外界电压的变化最 终将导致波导有效折射率的变化. Add-drop 型微环 的 Through 端输出光强透射率与器件各参数的关 系^[12,13] 如下:

$$T_{\text{Through}} = \left| \frac{E_t}{E_i} \right|^2 = \left| \frac{t_1 - \alpha t_2 \, \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}}{1 - \alpha t_1 t_2 \, \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}} \right|^2$$
$$= \frac{(t_1 - \alpha t_2)^2 + 4\alpha t_1 t_2 \sin^2(\varphi/2)}{(1 - \alpha t_1 t_2)^2 + 4\alpha t_1 t_2 \sin^2(\varphi/2)}, \quad (1)$$

其中 t_1 和 t_2 分别表示微环与输入端 (Through 端) 波导以及下载端 (Drop 端) 波导的振幅透射率, 在忽 略耦合区损耗的情况下与耦合系数满足 $\kappa_1^2 + t_1^2 = 1$ 和 $\kappa_2^2 + t_2^2 = 1$ 的关系; $\alpha = e^{-\alpha_0 L/2}$ 表示光在环内传 输一周的振幅损耗因子, 其中 α_0 表示微环的传输 损耗, $L = 2\pi R$ 表示微环的周长; $\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} n_{\text{eff}} L$ 表示 光在微环内传输一周后的相位变化, 其中 n_{eff} 表示 波导的有效折射率, λ 表示入射光波长. 因此, 根据



上述关系,通过改变调制区波导的反偏电压,从而 改变波导的有效折射率,就可以实现对输出光强的 调制.

调制带宽是电光调制器的重要性能参数,对于 硅基微环型电光调制器来说,通常由器件的光响应 和电响应共同决定^[9].其中电响应指调制带宽受调 制区载流子输运的影响,并与调制区驱动电极的寄 生 *RC* 常数有关;光响应指由微环谐振腔内的光子 寿命引起的带宽限制,通常是影响基于微环谐振腔 的反偏 pn 型硅基电光调制器带宽的主要因素.其 带宽 (BW) 和微环 *Q* 值的关系可以表示为^[11]

$$\mathbf{BW} = c/(\lambda Q), \tag{2}$$

其中 *c* 表示真空中光的传播速度, λ 为入射光波长, *Q* 值与微环各参数的关系为

$$Q = (\pi n_{\rm g} L/\lambda) \frac{\sqrt{\alpha t_1 t_2}}{\sqrt{|(1 - \alpha t_1 t_2)^2 - 2(t_1 - \alpha t_1 t_2)^2|}}, \quad (3)$$

其中 ng 表示光在波导中传输的群速度.如果采用 Through 端作为调制器的光输出端,并设输出较强 光信号时的状态为调制器的 "On"状态,输出较弱 光信号时的状态为 "Off" 状态,则调制器的消光比 (ER) 可以表示为

$$\mathbf{ER} = -10 \cdot \lg \frac{T_{\mathrm{Through}}|_{\mathrm{On}}}{T_{\mathrm{Through}}|_{\mathrm{Off}}},\tag{4}$$

其中 T_{Through}|On 和 T_{Through}|Off 分别表示 "On" 状态 和 "Off" 状态的输出光强透射率. "On" 状态所引入 的额外损耗可以表示为

$$\text{Loss} = -10 \cdot \lg(T_{\text{Through}}|_{\text{On}}). \tag{5}$$



图 1 (a) 器件的整体结构俯视图; (b) 调制区的结构图

2.2 波导结构的设计

在高速数据传输的应用中,如果光波导支持多 个模式,每个模式传播信号的速率不一样,将会引 起数据码间干扰,严重影响接收端对信号的解读, 因此应该保证波导是单模工作的. 我们使用的 SOI 芯片为新加坡 IME 的顶层硅厚度为 220 nm 的晶 片, 埋氧层厚度为 2 µm. 为了保证光波导的单模传 输, 刻蚀深度采用 160 nm, 波导宽度采用 500 nm, 波导上面覆盖一包层二氧化硅. 利用基于薄膜模式 匹配法的商用光波导仿真软件 Fimmwave^[14] 计算 波导中的模式,结果表明,所得的模式中仅仅有一 个是导模,为准 TE 模,剩下都是辐射模,不存在 TM 导模.准 TE 模的模场分布如图 2 所示,模式的有效 折射率为 2.494,群折射率为 3.8.



图 2 波导准 TE 模的模场分布

2.3 直波导与微环谐振腔耦合的设计

根据前面分析可知,直波导与微环谐振腔之间 的耦合会对电光调制器的输出特性有所影响,因 此需要加以优化设计.利用基于本征模叠加法的光 波导仿真软件 Fimmprop^[14] 计算得到不同直波导 和微环之间的 Gap 值对应的耦合系数如图 3(a) 所 示,随着 Gap 值的增大,直波导和弯曲波导的光相 互作用越弱,耦合系数也越小.微环中的传输损耗 由弯曲损耗和由掺杂工艺、刻蚀工艺等引起的吸 收、散射损耗决定.弯曲损耗根据仿真软件计算可 得约 0.9 dB/cm, 由掺杂工艺、刻蚀工艺等引起的 其他损耗根据器件制作采用的工艺^[15]可知约为 10 dB/cm. 因此微环内总的传输损耗约 10.9 dB/cm, 振幅衰减因子 $\alpha = 0.9844$. 同样, 根据文献中的结 果,经计算可得波导有效折射率的改变值随 pn 结 反偏电压的变化如图 3(b) 所示. 可以看出, 随着反 偏电压的增加,其折射率相对无偏压情况的增加值 不断增大.在1V反偏电压作用下,波导有效折射 率的改变值约为 5.4×10⁻⁵.

为了探讨 Through 端直波导与微环耦合以及 Drop 端直波导与微环耦合对调制器性能的影响, 我 们首先给定 Through 端直波导与微环之间的 Gap 值为 250 nm,并假定调制器 "On"状态的额外损耗 为 2 dB,调制区外加反偏电压大小为 2 V. 计算得到 Drop 端直波导与微环的耦合系数 k₂ 与调制器带宽 和静态电光响 应消光比之间的关系如图 4(a) 所示.



图 3 (a) 耦合系数与 Gap 值的关系; (b) 有效折射率的改变值 随反偏电压的变化

可以看出,较小的耦合系数对应着更大的消光比, 而随着耦合系数的减小,带宽首先增大然后逐渐 减小. 当耦合系数减为0时, 就对应 All-pass 微环 的情况,此时虽然消光比可以很大,但是器件的带 宽非常低.为了得到高消光比并且良好的带宽特 性,我们选择 Drop 端直波导与微环之间的 Gap 值 为 300 nm, 此时耦合系数 k₂ = 0.1365, t₂ = 0.9906, 对应的带宽为 8.8 GHz, 消光比约 8 dB. 当 Through 端的直波导与微环之间的 Gap 值分别为 200 nm, 230 nm, 250 nm, 300 nm 时, 不同反偏电压下调制 器的静态电光响应消光比如图 4(b) 所示. 四种情 况对应的带宽分别为 12.4 GHz, 10.3 GHz, 8.8 GHz 和 5.2 GHz. 对于 Gap 值为 200 nm 的情况, 带宽最 高,消光比随着反偏电压的增加而逐渐增大,但是 变化较缓慢,微环谐振腔处于深度过耦合状态;对 于 Gap 值为 300 nm 的情况, 虽然在较低电压时, 消 光比较大,但是最大消光比仅仅5dB左右,而且 带宽很低, 微环谐振腔处于深度欠耦合状态; 对于 Gap 值为 230 nm 的情况, 微环谐振腔处于临界耦 合的状态,此时通过加高反偏电压可以得到非常高 的消光比,比如在 3.8 V 的反偏电压下,消光比可高 达 30 dB; 而对于 Gap 值为 250 nm 的情况, 微环谐

振腔处于轻度欠耦合的状态,虽然最大消光比没有临界耦合时的大,但是其在较低的反偏电压范围内 (0—3.2 V)其消光比都比临界耦合时的大,同时也 具有较高的带宽,因此我们选择 Through 端直波导 与微环之间的 Gap 值为 250 nm 作为最终的器件设 计参数,从而在带宽较高的同时能够保证较低的反 偏电压就实现高消光比.



图 4 (a) Through 端 Gap 值为 250 nm 时,不同 Drop 端耦合 系数 k_2 对应的调制器带宽和 2 V 电压下的消光比; (b) 不同 Through 端 Gap 值对应的消光比随反偏电压的变化

3 测试结果

根据前面的设计参数,我们制作了相应的基于 Add-drop 型微环谐振腔的硅基电光调制器.器件 的 SEM 图如图 5(a) 所示.对器件施加不同的反偏 电压并进行光谱扫描,得到不同反偏电压下的光谱 如图 5(b) 所示.可以看出,如果选择入射光波长为 1543.67 nm,则在 3 V 的反偏电压下调制器的消光 比可以达到最大值,约 12 dB. 与理论计算值相比, 最大消光比稍小,主要是由于在测试光路中光放大 器的输出增益光饱和导致的.

同时我们还做了动态电光响应测试,利用矢量 网络分析仪测得了入射波长为 1543.67 nm,反偏电 压为 -1 V 时的电光响应如图 6(a) 所示.可以看出,





图 5 (a) Add-drop 型微环电光调制器的 SEM 图; (b) 不同反偏 电压下的光谱





图 6 (a) 调制器的电光响应曲线; (b) 8 Gbps 数据传输速率时 的测试眼图

电光响应的 3 dB 带宽约 8.5 GHz, 跟前面的理论分 析比较接近. 采用伪随机信号发生器作为输入电信 号, 并利用光电探测器及高频采样示波器探测输出 端的光强变化. 在反偏电压为 –1 V, 信号幅值电压 V_{pp} = 1.2 V 时, 测得的 8 Gbps 数据传输速率的眼 图如图 6(b) 所示. 可以看出, 眼图张开的较好, 表明 我们的器件能够应用于传输高频数据信号. 理论上, 更高数据速率的眼图可以被观测到. 因为我们器件 的静态消光比较高, 即使高频出现衰减也能够观测 到张开的眼图. 然而受限于测试条件, 由于实验台 不稳等因素, 导致眼图的测试受周围环境的噪声干 扰, 将会在后续的实验中加以改进.

4 结 论

本文设计并制作了基于 Add-drop 型微环的硅

- [1] Wu Y P, Tao Y, Zhang J S, Wang Y G 2010 Acta Phys. Sin. **59** 4395 (in Chinese) [吴懿平, 陶媛, 张金松, 王永国 2010 物理学报 **59** 4395]
- [2] Miller D 2009 Proceedings of the IEEE 97 1166
- [3] Jalali B, Fathpour S 2006 IEEE J. Lightwave Technol. 24 4600
- [4] Reed G T, Mashanovich G, Gardes F Y, Thomson D J 2010 Nat. Photon. 4 518
- [5] Li Y M, Liu Z, Xue C L, Li C B, Cheng B W, Wang Q M 2013 Acta Phys. Sin. 62 114208 (in Chinese) [李亚明, 刘智, 薛春来, 李传波, 成 步文, 王启明 2013 物理学报 62 114208]
- [6] Xu Q, Schmidt B, Pradhan S, Lipson M 2005 Nature 435 325
- [7] Wang F, Qiu C, Xiao S M, Hao Y L, Jiang X Q, Wang M H, Yang J Y 2009 Chin. Phys. Lett. 26 104206
- [8] Xu H, Xiao X, Li X Y, Hu Y T, Li Z Y, Chu T, Yu Y D, Yu J Z 2012 Opt. Express 20 15093
- [9] Dong P, Liao S, Feng D, H. Liang, Zheng D, Shafiiha R, Kung C C,

基电光调制器,通过引入 Drop 端,在不改变掺杂工 艺的条件下实现了调制器性能的均衡提升,制作了 较高带宽且在低调制电压下实现大消光比的器件. 首先计算了光波导结构的模式以及直波导与光波 导的耦合系数与 Gap 值之间的关系,并重点分析了 Through 端与 Drop 端直波导与微环的耦合对器件 消光比以及带宽的影响.结果表明,当 Drop 端 Gap 值取 300 nm,且 Through 端 Gap 值取 250 nm 时,器 件兼顾良好的消光比与较高的带宽.对实际制作 的器件进行了静态光谱测试与动态电光响应测试, 在 3 V 偏置电压的作用下,静态电光响应的消光比 最大可达 12 dB;给定 1 V 反向偏置,在 1.2 V 的信 号幅值电压下,我们测得了 8 Gbps 数据传输速率 的眼图.

Qian W, Li G, Zheng X, Krishnamoorthy A V, Asghari M 2009 Opt. Express 17 22484

- [10] Dong P, Liao S, Liang H, Qian W, Wang X, Shafiiha R, Feng D, Li G, Zheng X, Krishnamoorthy A V, Asghari M 2010 Opt. Lett. 35 3246
- [11] Li G, Zheng X, Yao J, Thacker H, Shubin I, Luo Y, Raj K, Cunningham J E, Krishnamoorthy A V 2011 Opt. Express 19 20435
- [12] Huang Q Z 2009 Ph.D. Dissertation (Beijing Graduate School of Chinese Academy of Sciences) (in Chinese) [黄庆忠 2009 博士学位论文 (北京: 中国科学院研究生院)]
- [13] Ren G H, Chen S W, Cao T T 2012 Acta Phys. Sin. 61 034215 (in Chinese) [任光辉, 陈少武, 曹彤彤 2012 物理学报 61 034215]
- [14] FIMMWAVE/FIMMPROP, Version 4.6, Photon Design Ltd, http://www.photond.com
- [15] Liow T Y, Ang K W, Fang Q, Song J F, Xiong Y Z, Yu M B, Lo G Q, Kwong D L 2010 IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 16 307

Design of a high-speed silicon electro-optical modulator based on an add-drop micro-ring resonator*

Cao Tong-Tong Zhang Li-Bin Fei Yong-Hao Cao Yan-Mei Lei Xun Chen Shao-Wu[†]

(State Key Laboratory on Optoelectronics, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China) (Received 27 April 2013; revised manuscript received 19 June 2013)

Abstract

Silicon electro-optical modulators based on add-drop micro-ring resonators have the advantage of more freedom in designing high-extinction-ratio and large-bandwidth modulators without changing the ion doping processes of the chip. Here we design a high-speed silicon modulator based on an add-drop micro-ring resonator with a radius of 20 μ m; it demonstrates high extinction ratio with low reverse bias. How the coupling between the straight waveguide and the ring resonator affects the performances is studied theoretically and it is found that a lower coupling coefficient at drop port leads to a higher extinction ratio but not the best bandwidth. Therefore, a balance should be considered between extinction ratio and bandwidth. According to the optimized result of the parameters the device is fabricated and tested. The spectrum testing indicates that the device can have 12 dB extinction ratio when it is operated at 3 V reverse bias. Furthermore, we have observed 8 Gbps open-eye diagram with only 1.2 V peak-to-peak signal voltage.

Keywords: electrode-optical modulator, silicon on insulator, micro-ring resonator, free-carrier dispersion effect

PACS: 42.82.-m, 42.79.Hp

DOI: 10.7498/aps.62.194210

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 60837001, 61021003).

[†] Corresponding author. E-mail: swchen@semi.ac.cn